

ISO規格準拠、 目視&自動観察のダブルチェック可能な コンタミ検査システムを Leica (ライカ) で実現しませんか？

清浄度 (コンタミ) 評価
目視観察&自動検査測定システム
Leica Cleanliness Expert

Leica(ライカ)の測定システムは
人の習熟度や測定結果の定量化など、
さまざまな課題を解決します。

- ✓ 異物特定専用で40年の信頼と実績
- ✓ どの業界でも使える実用性
- ✓ 圧倒的な精度と高い測定力
- ✓ 目視観察できる安心感
- ✓ ISO16232 対策のご提案とサポート



コンタミ自動測定システム
Leica(ライカ) Cleanliness Expert

▼ 適用分野の例



レポート対応工業規格

- ISO16232
- VDA19
- ISO4406
- DIN51455
- USP788
- SAE AS4059
- NAS1638 など、その他ユーザー設定可能



国際規格 ISO16232、ドイツ自動車工業会規格 VDA19.1の「路上走行車一部品(機器)とシステムの清浄度」は摺動部品だけでなく、電装品も対象であり、欧米メーカーとの取引では清浄度評価検査が必須になっており、取引では品質管理レポート提出がほぼ必須になっています。

Leica(ライカ)の 洗浄度評価測定 システムの特徴

- 約40年の経験と実績から最適化された、規格に準じたシステム
- 高い光学系で異物を検出、アイピース(接眼レンズ)による観察で目視でダブルチェックが可能
- 信頼性ある観察条件で、再現性高い検査とレポート出力
- 測定条件によって、最適な顕微鏡を選択可能
- 将来のメンテナンスや更新を考えた場合、カメラ+PCの変更でシステム更新でき低コストで対応可能。
- ISO16232やVDA19.1など規格に準じた試験のコンサルテーション提案

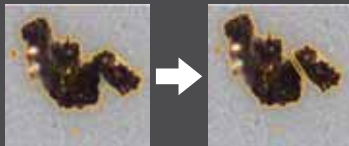
検出、測定、分類

明るさや閾値設定に加え、ニーズやサンプル特性に応じてライカのエキスパートがコンサルテーション。再現性の高い検査が可能。



結果の確認、目視でダブルチェック

顕微鏡法の限界により、粒子が本来と異なり、分割あるいは結合、また金属光沢粒子と間違った特性化で、分類されることがあります。リスク回避するために、熟練作業員によって接眼レンズ越しにダブル検査が行われ、粒子を再測定できる機能を提供。



パーティクル分離機能

結果出力

ISO16232やVDA19.1に準拠し、規格で決められた粒子サイズのランク別に一覧表示。選択した粒子解析は高さ測定などで詳細解析も可能。



ユーザー様の声



航空宇宙産業企業であるAllinox社では、Cleanliness Analysis Advanced Systemを導入し、部品に付着した重要粒子の分析に使用しています。P4TF21などの航空宇宙規格に基づき、5μmの微粒子を分析し、反射性あるいは非反射性粒子を区別しています。ライカソリューションを導入後、洗浄度分析の効率を高め、製品の品質と信頼性を大幅に向上させました。

Alberto Biuso
CEO兼ビジネス開発マネジメントマネージャー, Allinox Components, 10156 Torino / Italy

過去開催したワークショップ参加者の声



マイクロスコープの閾値の設定や、洗い出し方法の決め方など、具体的な手順が明確になりました。



ISO16232には必ず守らなければいけない部分と、守るかどうかを判断すべき部分がある、ということがよく分かりました。また、デモを見て、何を評価できるかも分かりました。今後のコンタミ評価の参考にしたいと思います。

何から始めたらよいのか？

現在の検査方法は最適なのか？

今使用しているシステムは、最近の規格に対応しているのか？

そもそも「ISO16232」で何が要求されているか分からない...

**お困りごとがありますか？
まずはLeica(ライカ)にご相談ください。**

実機を用いた説明会・講習会のご要望、ご相談も承ります。

▼お問合せフォーム (Microsoft Forms) ▼
<https://forms.office.com/r/Lr4bHkd4nj>

ライカ マイクロシステムズ株式会社

本社
〒169-0075 東京都新宿区高田馬場 1-29-9
Tel.03-6758-5656 Fax.03-5155-4333

大阪セールスオフィス
〒531-0072 大阪府大阪市北区豊崎 5-4-9 商業第2ビル 10F
Tel.06-6374-9771 Fax.06-6374-9772

名古屋セールスオフィス
〒460-0008 名古屋市中区栄 2-3-31 CK22キリン広小路ビル 5F
Tel.052-222-3939 Fax.052-222-3784

<https://www.leica-microsystems.com/jp/>
Email:lmc@leica-microsystems.co.jp



製品情報はこちら



お問合せはこちら

ご依頼・お問い合わせは私までお気軽にお声がけください。